

Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Untersuchungen zum eingebetteten Selbsttest von statischen Halbleiterspeichern“ ist ein zu 100% industriefinanziertes Projekt im Auftrag der Firma Infineon Technologies über drei Jahre. Von dem Projekt wird ein Mitarbeiter, sowie Reise- und Sachkosten bezahlt.

Dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt hat zum Ziel, für Halbleiterchips, auf denen statische Speicher enthalten sind neue Selbsttestschaltungen mit optimierten Algorithmen zu entwickeln. Um an die dazu notwendigen Erkenntnisse zu gelangen, werden zunächst in enger Abstimmung und Kooperation bestehende Schaltungen hinsichtlich Fehlermechanismen und Testüberdeckung aus laufender Produktion untersucht.

Es ist geplant, dass der Mitarbeiter im Rahmen einer kooperativen Promotion mit der University of Ulster während der Projektlaufzeit mit einem Doctor of Philosophy (PhD) promoviert. Projektleiter und Betreuer ist Prof. Dr.–Ing. Dr. h.c. Alfred Eder, Fakultät für Elektrotechnik.